

- 오류정정 -

학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 29(2), 9 (2022)
논문제목	“저융점 Sn-Bi 솔더의 신뢰성 개선 연구”
요청부분	(pp.9) 참고문헌 편집 및 표기 오류 32. M. McCormack, H. S. Chen, G. W. Kammlott, and S. Jin, “Significantly improved of Bi-Sn solder
정정	(pp.9) 참고문헌 편집 및 표기 오류 정정 32. M. McCormack, H. S. Chen, G. W. Kammlott and S. Jin, “Significantly Improved Mechanical Properties of Bi- Sn Solder Alloys by Ag- Doping”, J. Electron. Mater., 26(8), 954-958 (1997).
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 29(2), 9 (2022)
논문제목	“저융점 Sn-Bi 솔더의 신뢰성 개선 연구”
요청부분	(pp.9) 참고문헌 번호 표기 오류 34. ~ 43.
정정	(pp.9) 참고문헌 번호 표기 오류 정정 33. ~ 42.
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 29(2), 29 (2022)
논문제목	“전자소자 열분석을 위한 열반사 현미경 기술”
요청부분	(pp.29) 장 번호 표기 오류 4. 결론
정정	(pp.29) 장 번호 표기 오류 정정 3. 결론
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 29(2), 71 (2022)
논문제목	“Laser Source 특성 분석을 통한 Low Depth Marking 공법 연구 및 고찰”
요청부분	(pp.71) 큰따옴표 중복 표기 오류 1. P. E. B. Paranal, ““Localized Die Metallization Damage Induced during Laser-marking of a Semiconductor Package”, Intel Technology Philippines, Inc., ISTFA, (2007).
정정	(pp.71) 큰따옴표 중복 표기 오류 정정 1. P. E. B. Paranal, “Localized Die Metallization Damage Induced during Laser-marking of a Semiconductor Package”, Intel Technology Philippines, Inc., ISTFA, (2007).
학회지 및 페이지	J. Microelectron. Packag. Soc., 29(2), 104 (2022)
논문제목	“전송선로에 적용한 Low-k 고분자 복합 잉크 개발”
요청부분	(pp.104) 장 번호 표기 오류 5. 결론
정정	(pp.104) 장 번호 표기 오류 정정 4. 결론